

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук**  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
**главного научного сотрудника – заведующего лабораторией, доктора наук**  
в лаборатории дифракционных методов исследования реальной структуры кристаллов  
Вакансия *VAC\_PTI\_22009*

**Тематика исследований.**

Исследование реальной структуры материалов и наноразмерных устройств для перспективных технологий с использованием методов дифракции синхротронного излучения установок класса мегасайенс и рентгеновского излучения лабораторных источников.

**Трудовая деятельность.**

Организация и участие в научных исследованиях по разработке новых материалов микроэлектроники и решении проблем биоматериаловедения в составе коллектива лаборатории, включая:

руководство работами, закрепленными за лабораторией в государственном задании Института:

организация взаимодействия с другими подразделениями института и с другими научными центрами;

обеспечение условий для выполнения государственного задания; получения и выполнения грантов на научные исследования в пределах компетенции сотрудников лаборатории, в частности:

исследование структурных свойств монокристаллов карбида кремния и нитрида алюминия с использованием методов рентгеновского фазово-контрастного и брэгг-дифракционного изображения в синхротронном излучении;

изучение связи структуры с электрофизическими свойствами гетеродиодов, изготовленных по технологии прямого сращивания монокристаллов Si и Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>;

разработку количественной рентгеновской фазово-контрастной технологии для диагностики и исследования микропор в технически важных монокристаллах;

моделирование рентгеновских фазово-контрастных изображений микрообъектов с целью определения их размеров и формы;

исследование биокompозитов методом микротомографии в синхротронном излучении и разработку моделей их механической прочности.

Руководство и обучение студентов и лаборантов фундаментальным и прикладным навыкам разработки и исследования материалов рентгеновскими методами.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 46 305 руб.

СТАВКА: 0.9

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.